

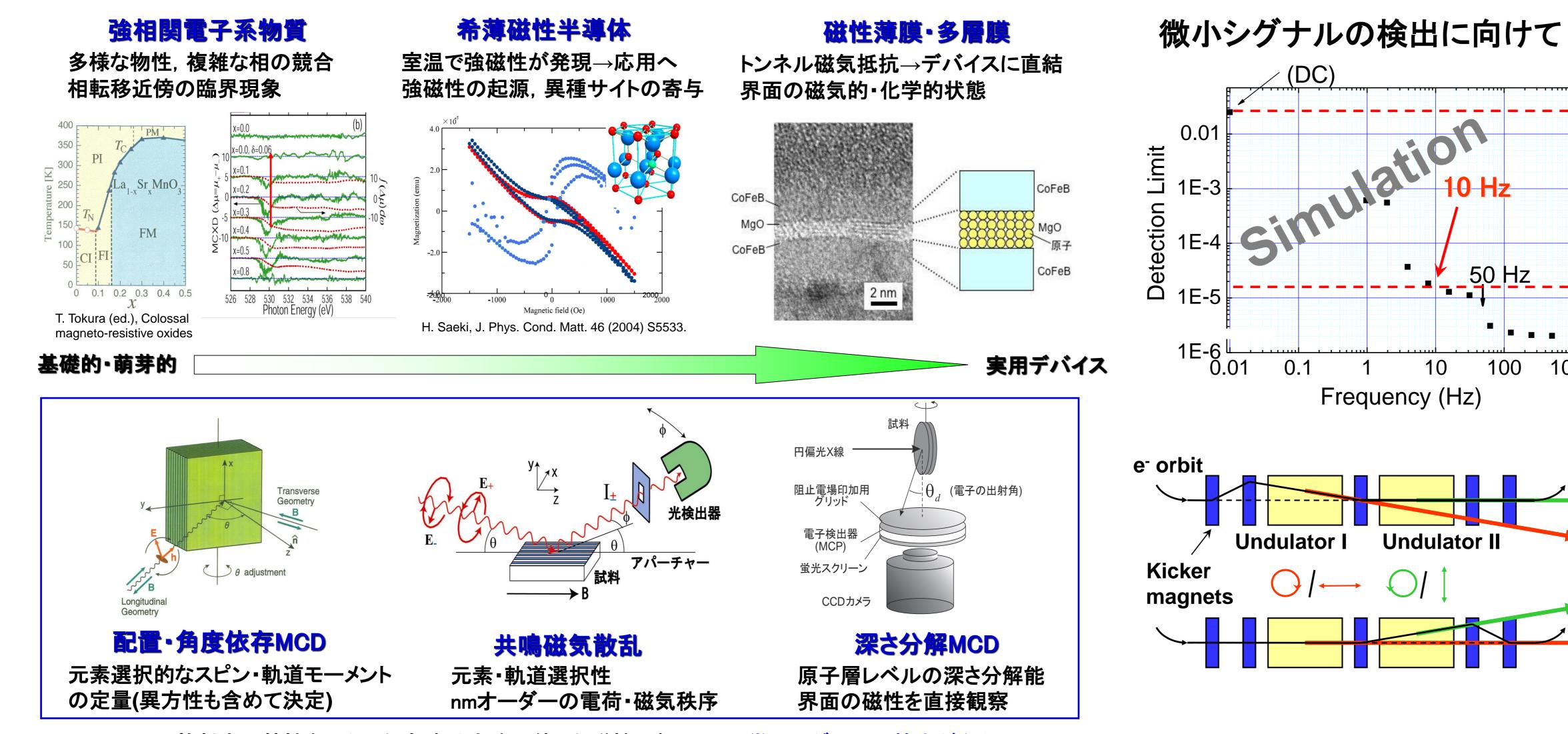
軟X線偏光スイッチングを用いたスピントロニクス材料の探求

Exploration of Spintronic Materials by means of Soft X-ray Polarization Switching

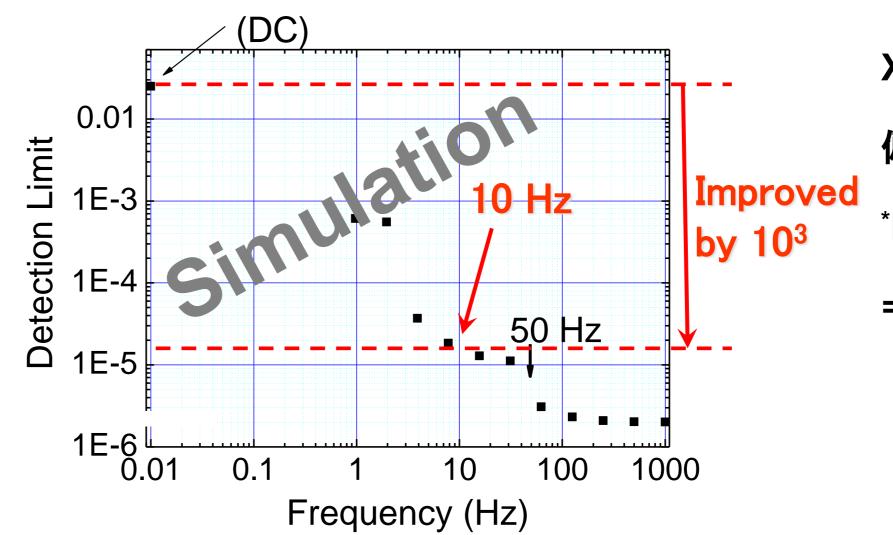
雨宮健太¹,藤森淳²,小出常晴¹,酒巻真粧子¹,門野利治²,Vijay Raj Singh², 石上 啓介³, Viendra Kumar Verma², 芝田 悟朗² ¹KEK放射光、²東大院理、³東大院新領域

現在BL-16Aでは, 軟X線領域(200-1500 eV)において10 Hz程度の高速偏光スイッチング(左右円偏光および水平・垂直直線偏光) の開発を進めている。この技術を軟X線吸収および軟X線共鳴散乱における磁気円二色性(XMCD)・線二色性(XMLD)に適用すれ ば、ロックイン法を用いることによって、直流的な測定では10⁻²程度が検出下限であったXMCD, XMLD測定において10⁻⁴-10⁻⁵の極微 小シグナル検出が可能になる。本研究の目的は、このような極微小シグナル検出技術を確立し、それを利用して、磁性薄膜・多層膜、 希薄磁性半導体、強相関電子系物質といった、現在および将来のスピントロニクス材料の探究を行うことである。

本研究のターゲットと実験手法

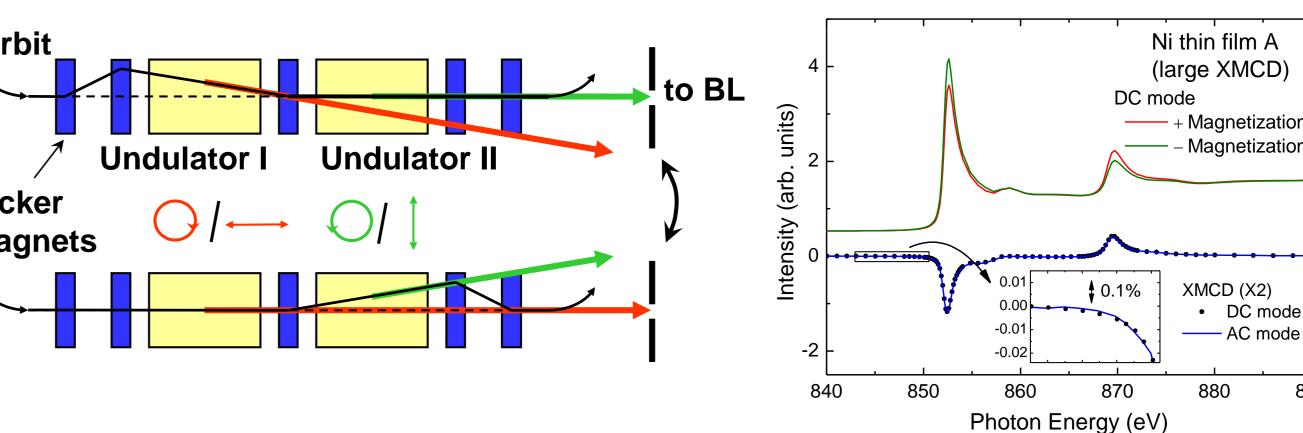


微小シグナルの検出が必須



XMCD, XMLD 検出限界:~1% (DC mode*) 偏光スイッチング+ロックイン法 10-4-10-5 のシグナル観測可能 *DC mode: without switching

⇒ BL-16Aにおいて偏光の 高速スイッチング(~10Hz) を開発中 (施設報告およびFB-03等)



放射光の特性をいかした実験手法 を駆使した磁性の解明 ⇒

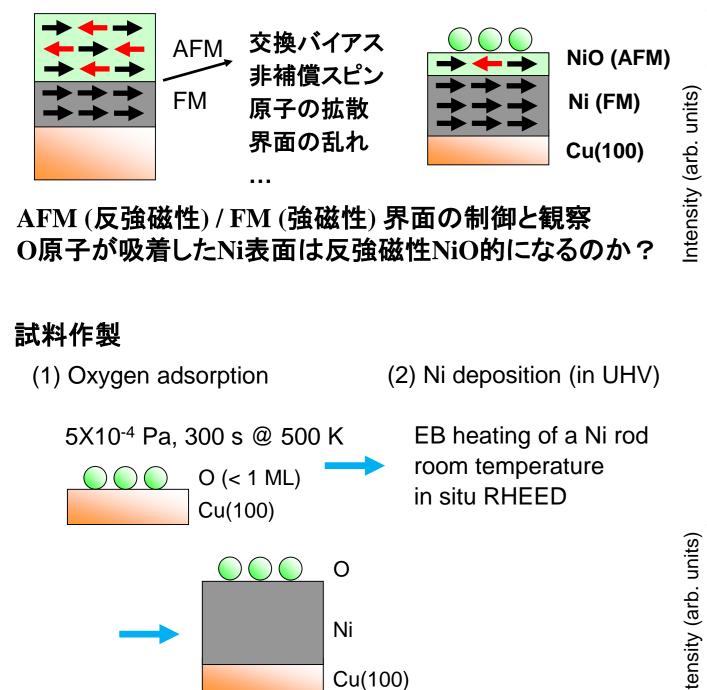
研究成果(1): La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃薄膜

共同研究者: 吉松公平,組頭広志,尾嶋正治(東大院工)

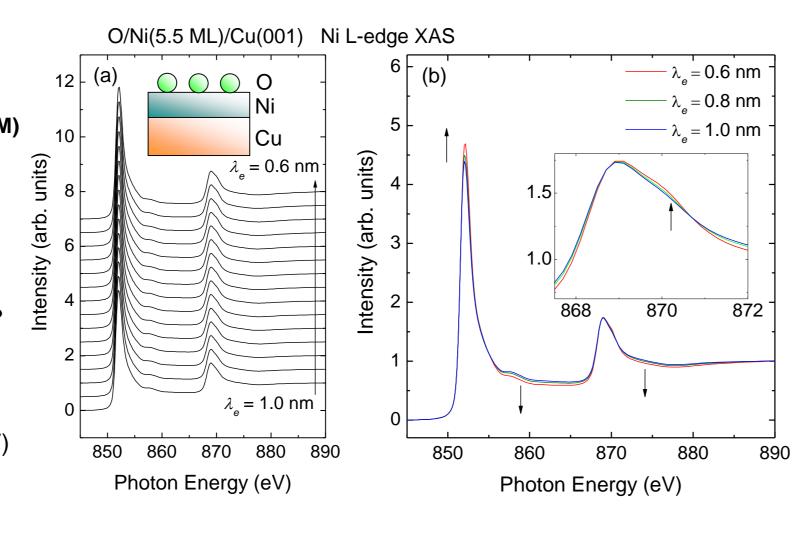
研究成果(2): Fe-doped ZnO

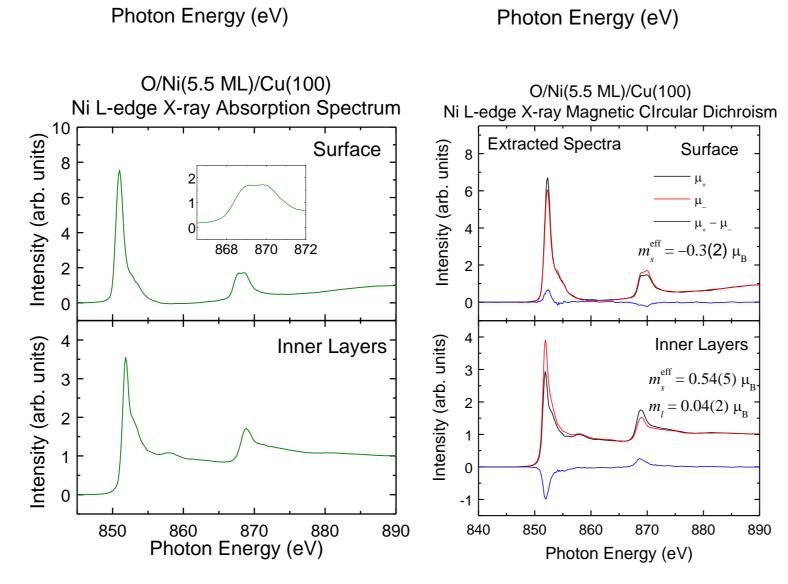
共同研究者: S.Chattopadhyay, T.K.Nath (Indian Institute of Technology)

研究成果(3): Ni薄膜表面におけるNiO類似構造



深さ分解XAFS (XMCD) 測定 表面に1原子層のNiO類似構造を確認 わずかながらNiと逆向きのモーメントが存在?





まとめと今後の展開

- 可変偏光ビームラインBL-16Aを用いてスピントロニクス関連物質の基礎的研究を開始
- 強相関電子系、希薄磁性半導体、金属磁性薄膜について、XMCDの有効性を確認
- 現在開発中の偏光スイッチングによって、今後、シグナルの質の劇的な向上が見込まれる
- スピントロニクス材料開発を行っている研究者との連携

成果の発表 (主要なもの)

投稿論文

1. D.Asakura, T.Koide, S.Yamamoto, K.Tsuchiya, T.Shioya, K.Amemiya, V.R.Singh, T.Kataoka, Y.Yamazaki, Y.Sakamoto, A.Fujimori, T.Taira, and M.Yamamoto, "Magnetic states of Mn and Co atoms at Co₂MnGe/MgO interfaces seen via soft x-ray magnetic circular dichroism study" Phys. Rev. B 82 (2010) 184419.

- 2. K.Amemiya and M.Sakamaki, "NiO-like single layer formed on a Ni/Cu(001) thin film revealed by the depth-resolved x-ray absorption spectroscopy", Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 012501.
- 3. M.Sakamaki and K.Amemiya, "Element specifc magnetic anisotropy energy of alternately layered FeNi thin flms", Appl. Phys. Express 4 (2011) 073002.
- 4. K.Amemiya and M.Sakamaki, "Sub-nm resolution depth profiling of the magnetic structure of thin films by the depth-resolved X-ray magnetic
- circular dichroism technique", J. Phys. D 44 (2011) 064018.
- 5. M.Sakamaki and K.Amemiya, "Effect of surface roughness on magnetism of ultrathin Co films", J. Phys.: Conf. Ser., 266 (2011) 012020.

学会発表

- 1. A.Fujimori, "XMCD characterization of high-T_C diluted magnetic semiconductors", International Conference on Core Research and Engineering Science of Advanced Materials, Osaka, May-June, 2010.
- K.Amemiya, "Sub-nm resolution depth profiling of the magnetic structure of thin films by the depth-resolved X-ray magnetic circular dichroism technique", The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, Sendai, July 2010.
- 酒巻真粧子, 雨宮健太, "FeNi多層膜の作製とXMCDによる磁気異方性の研究", 第13回XAFS討論会, 滋賀, 2010年9月.
- 雨宮健太, 酒巻真粧子, "Cu(100)単結晶上に作製した交互積層FeNi多層膜の磁気異方性", 第71回 応用物理学会学術講演会, 長崎, 2010年9月 芝田悟朗, 石上啓介, V.R.Singh, V.K.Verma, 藤森淳, 小出常晴, 吉松公平, 組頭広志, 尾嶋正治, "La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃薄膜の軟X線磁気円二色性の 膜厚依存性", 日本物理学会秋季大会, 大阪, 2010年9月.
- 6. V.K.Verma, V.R.Singh, K.Ishigami, Y.Yamazaki, G.Shibata, T.Kadono, A.Fujimori, T.Koide, S.Chattopadhyay, and T.K.Nath, "X-ray absorption spectroscopy and x-ray magnetic circular dichroism study of Fe doped ZnO thin films", 日本物理学会秋季大会, 大阪, 2010年9月.
- 雨宮健太, 酒巻真粧子, "Cu/Ni/Cu(100)薄膜の界面および内部層における磁化の温度依存性", 日本物理学会秋季大会, 大阪, 2010年9月. 酒巻真粧子, 雨宮健太, " Mo/Co/Au薄膜の界面磁気異方性に関する考察", 日本物理学会秋季大会, 大阪, 2010年9月.